

**TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ INSTITUTO
ATVIROS PRIEIGOS CENTRŲ KAINORAŠTIS
2014.06.30**

VILNIAUS UNIVERSITETO FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ ATVIROS PRIEIGOS CENTRAS (VU FTM APC):

Puslaidininkių technologijų ir charakterizavimo atviros prieigos centras

www.tmi.vu.lt

APC koordinatorius Justinas Baužys, 37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt

Puslaidininkių technologijų ir charakterizavimo atviros prieigos centras

Saulėtekio al. 10, 101-118 kab.

Dr. Gintautas Tamulaitis, 85 2366071, gintautas.tamulaitis@ff.vu.lt

Dr. Roland Tomašiūnas, 852366069, roland.tomasiunas@ff.vu.lt

Dr. Eugenijus Gaubas, 852366082, eugenijus.gaubas@ff.vu.lt

Dr. Kęstutis Jarašiūnas, 852366036, kestutis.jarasiunas@ff.vu.lt

Eil. Nr.	Įranga	Atsakingas personalas	Taikant visą kainą €/1 val.*
Puslaidininkių technologijų ir charakterizavimo atviros prieigos centras			
1.	Kristalinių sluoksnių epitaksijos iš metalo-organinių medžiagų garų fazės reaktorius (angl. k. MOCVD arba MOVPE)	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	215,13
2.	III grupės nitritinių puslaidininkinių darinių epitaksija MOCVD metodu	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	215,13
3.	Skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM) su rentgeno spindulių energijos dispersijos (EDX) ir elektroninio spindulio indukuotų srovių (EBIC) matavimo priedais	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	47,63
4.	Kietų medžiagų paviršių tyrimai skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM)	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	47,63
5.	Kietų medžiagų cheminė mikroanalizė skenuojančiu elektroniniu mikroskopu su EDS/EDX priedėliu	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	47,74
6.	p-n sandūrų ir puslaidininkinių medžiagų paviršių tyrimai skenuojančiu elektroniniu mikroskopu su EBIC priedėliu	Dr. Arūnas Kadys, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	49,85
7.	Jonų reakcinio ėsdinimo įrenginys	Dokt. Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	51,21
8.	Puslaidininkinių struktūrų ėsdinimas sausuoju būdu	Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	51,21
9.	Greito termino atkaitinimo krosnis	Dokt. Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	19,99
10.	Spartus medžiagų atkaitinimas 0 – 1200 °C	Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	20
11.	Medžiagų poliravimas	Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	9,54
12.	Optinio polinimo stendas	Dr. Roland Tomašiūnas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	24,82
13.	Molekulių optinio polinimo tyrimas	Dr. R. Tamošiūnas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	21,65
14.	4-ių zondų varžos matavimo ir puslaidininkinio kristalo laidumo tipo nustatymo prietaisais (Jandel keturių zondų sistema su RM3000 testavimo įranga)	Dr. Vitalijus Bikbajevs, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	7,99
15.	Varžos matavimas keturių zondų metodu	Dr. Vitalijus Bikbajevs, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	8,05
16.	Bandinių charakterizavimas Holo metodu	Dr. Vitalijus Bikbajevs, +37060034126,	8,33

		justinas.bauzys@tmi.vu.lt	
17.	Ecopia HMS-3000 Holo matavimų įranga	Dr. Vitalijus Bikbajevs, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	8,33
18.	Šlifavimo ir poliravimo įrenginys Struers LaBoPol – 1	Dokt. Ignas Reklaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	9,54
19.	NIR spektrometras su CCD kamera ir priedais, spektrinis diapazonas 0,8-2,2 μm	Dr. Jūras Mickevičius, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	22,55
20.	Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis sąlygomis NIR spektro ruože	Dr. Jūras Mickevičius, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	22,55
21.	Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis sąlygomis ir su nanosekundine laikine skyra UV-VIS spektro ruože	Dr. Jūras Mickevičius, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	35,58
22.	Daugiakanalė spektroskopijos analizės įranga, spektrinis diapazonas 200-850 nm, kompletas	Dr. Gintautas Tamulaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	36,02
23.	Daugiafunkcinė mikroskopijos sistema: atominės jėgos mikroskopas (AFM), konfokalinis mikroskopas ir artimojo lauko optinis mikroskopas (SNOM)	Dr. Gintautas Tamulaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	39,32
24.	Paviršiaus morfologijos matavimas atominės jėgos mikroskopu (AFM)	Dr. Gintautas Tamulaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	39,32
25.	Erdviškai išskirtos liuminescencijos matavimai konfokaliniu mikroskopu	Dr. Gintautas Tamulaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	41,68
26.	Erdviškai išskirtos liuminescencijos matavimai artimojo lauko skenuojančiuoju optiniu mikroskopu (SNOM)	Dr. Gintautas Tamulaitis, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	45,87
27.	Impulsinis X-dažnio juostos EPR spektrometras (Bruker Eleksys E580)	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	119,51
28.	Elektronų sukinių (EPR) spektrinė analizė defektų, priemaišų, laisvųjų radikalų identifikavimui kristaliniuose ir organiniuose dariniuose kambario temperatūroje	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	119,51
29.	Elektronų sukinių (EPR) spektrinė analizė defektų, priemaišų, laisvųjų radikalų identifikavimui kristaliniuose ir organiniuose dariniuose temperatūroje nuo 300 iki 90K	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	136,3
30.	Radiacinių defektų tankio ir dozimetrijos įrenginys VUTEG-5 hadronų apšvitoms kontroliuoti	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	11,72
31.	Fotojonizacinės spektroskopijos VU gamybos įrenginys	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	19,91
32.	Volt-amperinių ir volt-faradinių charakteristikų temperatūrinių kitimų matavimo įrenginys	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	19,91
33.	Sandūrų barjero parametrų įvertinimo įrenginys BELIV-VU	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	13,33
34.	Giliųjų lygmenų tyrimo HERA – DLTS System FT 1030 spektrometras	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	17,51
35.	Rekombinacijos parametrų technologinės kaitos tyrimų, planarinio bei sluoksninio skenavimo daugiak funkcinis įrenginys VUTEG-4	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	15,04
36.	Radiacinių defektų evoliucijos ir rekombinacijos parametrų kaitos in situ matavimų, apšvitinant aukštųjų energijų dalelėmis, įrenginys VUTEG-3	Dr. Eugenijus Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	45,98
37.	Didelių radiacinių apšvitų aplinkos dozimetrinis monitoringas	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	11,72

38.	Giliųjų centrų foto-jonizacinė spektroskopija	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	17,51
39.	Volt-amperinių ir volt-faradinių charakteristikų temperatūrinių kitimų kombinuoti tyrimai sandūrų darinių funkciniam parametrams įvertinti	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	19,91
40.	Sandūrų barjero parametrų kitimų Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkinių prietaisų tyrimai	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	13,33
41.	Sandūrų barjero parametrų kitimų Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkinių prietaisų tyrimai, keičiant temperatūrą	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	13,33
42.	Giliųjų lygmenų, suformuojamų technologinėmis procedūromis, spektro kitimų tyrimai	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	23,16
43.	Puslaidininkinių medžiagų krūvininkų gyvavimo trukmių matavimai skersinės ir planarinės žvalgos būdais	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	15,04
44.	Puslaidininkinių medžiagų krūvininkų gyvavimo trukmių matavimai pašvitos būdu	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	45,98
45.	Radiacinių defektų evoliucijos ir rekombinacijos parametrų kaitos in situ matavimai, apšvitinant aukštųjų energijų dalelėmis	Dr. E. Gaubas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	45,08
46.	Sužadavimo-zondavimo ir dinaminių difracinių gardelių matavimų stendas	Dr. Ramūnas Aleksėjūnas, +37060034126, Justinas.bauzys@tmi.vu.lt	40,05
47.	Bekontaktis krūvio nešėjų gyvavimo trukmės ir difuzijos koeficiento nustatymas puslaidininkiuose ir jų dariniuose	Dr. Ramūnas Aleksėjūnas, +37060034126, justinas.bauzys@tmi.vu.lt	40,05

1. Kainos be PVM.

2. 50 % nuolaida vykdant bendrus projektus.

3. 25 % nuolaida VU mokslininkam ir studentams.

4. Įmonėms įsikūrusioms neanksčiau nei 12 mėn. iki paslaugos suteikimo datos – 30 proc. nuolaida.